

Anmeldung per Fax:
+49 (0) 67 32/93 51 23

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

- Ich nehme an der Veranstaltung „Berührungslose Schichtdickenmessung in der Qualitätskontrolle“ teil
- Bitte nehmen Sie mich in Ihren Newsletter-Verteiler auf

.....
Titel

.....
Name

.....
Vorname

.....
Firma (Rechnungsanschrift)

.....
E-Mail

.....
Telefon

.....
Straße (Rechnungsanschrift)

.....
PLZ / Ort (Rechnungsanschrift)

.....
Unterschrift

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB von Optence e.V.
Diese sind unter www.optence.de / AGB einsehbar.

Hinweis: Gem. §26.1 Bundesdatenschutzgesetz unterrichten wir Sie über die elektronische Speicherung Ihrer Daten und die Bearbeitung im automatischen Verfahren.

Teilnahmegebühr

- Mitglieder Kompetenznetze
Optische Technologien / DGaO 140,00 €
- Nicht-Mitglieder 180,00 €

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.

Im Preis enthalten sind Mittagessen, Kaffeepausen und Pausengetränke.

Bei Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung. Kreditkartenzahlung ist nicht möglich.

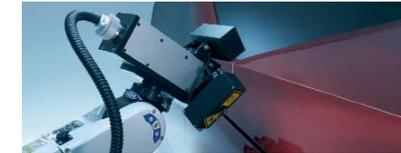
Mitglied im OptecNet



Geschäftsstelle Optence e.V.
Ober-Saulheimer-Straße 6
D-55286 Wörrstadt
Fon +49 (0) 67 32/93 51 22
Fax +49 (0) 67 32/93 51 23
reuter@optence.de
www.optence.de
www.cetip-optence.de



CETiP
BY OPTENCE
CONTINUING EDUCATION
& TRAINING IN PHOTONICS



EINLADUNG

Alle Motive: ITWM Kaiserslautern

3. Optence Messtechnik Symposium Berührungslose Schichtdicken- messung in der Qualitätskontrolle

30. Mai 2017 in Kaiserslautern

In Kooperation mit dem Zentrum für Materialcharakterisierung und -prüfung des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik





In der heutigen Produktion haben die meisten gefertigten Teile eine oder mehrere Beschichtungen, die den Teilen entweder einen Schutz bieten sollen oder sogar über die Funktion des Bauteils entscheiden. Die Prüfung der Dicken aufgebracht Schichten ist daher ein wichtiger Bestandteil in der Qualitätskontrolle. Um die Produktion nicht durch den Messprozess zu beeinträchtigen, sind berührungslose Messtechniken von großer Bedeutung.

Im Symposium werden unterschiedliche Methoden der berührungslosen Schichtdickenbestimmung und ihre Einsatzmöglichkeiten vorgestellt.

Zielgruppe

Firmen und Institute, welche sich mit dem Aufbringen und Charakterisieren von Schichten unterschiedlichster Materialien und Funktion beschäftigen.

**Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Bitte melden Sie sich frühzeitig an.**



Programm | Dienstag, 30. Mai 2017

- 10.00 **Begrüßung durch Daniela Reuter, Optence e.V., und Prof. Dr. Georg von Freymann, Fraunhofer ITWM**
- 10.20 **Schichtdickenmessung mittels kurzkohärenter Interferometrie**
Nicolai Brill, MABRI.VISION GmbH
- 10.50 **Ellipsometrie für die Produktion**
Dr.-Ing. Udo Riss, DRE-Dr. Riss Ellipsometerbau GmbH
- 11.20 **Kaffeepause**
- 11.50 **Nanometergenaue Ätztiefenkontrolle beim Trockenätzen mittels Reflektivitätsanisotropie-Spektroskopie**
Prof. Dr. Henning Fouckhardt, Technische Universität Kaiserslautern
- 12.20 **Chromatisch-konfokale und interferometrische Schichtdickenmessung**
Dr. Daniel Schröder, Precitec Optronik GmbH
- 12.50 **Mittagspause**
- 14.00 **Laserbasierte Schichtdickenmessung mittels ASOPS**
Dr. Mike Hettich, Universität Konstanz
- 14.30 **Industrielle Schichtdickenbestimmung mittels THz-TDS**
Dr. Frank Ellrich, Fraunhofer ITWM

- 15.00 **Elektronische Terahertz-Messtechnik**
Dr. Fabian Friederich, Fraunhofer ITWM
- 15.30 **Kaffeepause**
- 16.00 **Schichtdickenbestimmung mit Photothermie**
Dr. Stefan Böttger, Phototherm Dr. Petry GmbH
- 16.30 **Schichtdickenbestimmung mit Röntgenfluoreszenz**
Dr. Simone Dill, HELMUT FISCHER GmbH, Institut für Elektronik und Messtechnik
- 17.00 **Ende der Veranstaltung**

Moderation

Prof. Dr. Georg von Freymann,
Fraunhofer ITWM

Veranstaltungsort

Zentrum für Materialcharakterisierung und -prüfung des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik
Fraunhofer-Platz 1
67663 Kaiserslautern

